**附B：**

**高度控制测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  编号 | | 202001 | 测量过程  名称 | 铜线导体电阻率测量过程 | 测量过程规范编号 | | SMCL-GF-202001 |
| 所在部门 | | 品管部 | 测量项目 | 铜线导体电阻率≤0.17010Ω | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：直流电阻测量仪，测量范围（0-20）Ω，*U*rel=0.1%（*k*=2）。  测量方法：SMCL-GF-202001《铜线导体电阻率测量过程控制规范》、SMC-JC-ZY33《直流数显电阻仪作业指导书》、GB/T 3048.2—2007《电线电缆电性能试验方法 第2部分 金属材料电阻率试验》  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。  其他影响量： | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  1、查看直流电阻测量仪，其计量编号：010846，校准日期：2020年9月16日。符合要求。  2、检测过程有效性进行确认：  1)、2020年9月20日用编号010846的直流电阻测量仪对实物进行3次检测，平均值为=0.17009Ω  2)、2020年10月15日用编号010846的直流电阻测量仪对实物进行3次检测，平均值为=0.17000Ω  测量结果的扩展不确定度*U*=0.0002Ω *k*=2，则En=  当E n≤1时测量过程有效。此En=0.32<1，该测量过程有效。  确认人员： 日期：2020年10月15日 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日 期 | 变 更 内 容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |